Strombelastbarkeit von Leiterbahnen

Dr. Johannes Adam Flomerics Ltd. D-70794 Filderstadt http://www.flomerics.de

Bitte zitieren Sie, wenn Sie Material entnehmen.

Current Carrying Capacity of PCB Traces

Abstract.

The widely used design rule IPC-2221 (=MIL-STD-275) for the 'current carrying capacity' of traces on printed circuit boards is subject of a closer investigation. These historical studies on correlations between electrical current and temperature rise of the trace can be reproduced by numerical heat transfer simulations, but only if the board has a back 35μ m copper layer and the thickness of the trace is 35μ m. As this makes an application to other boards impossible, we are presenting diagrams based on numerical studies for FR4-based board models with other placing of copper planes and also for polyimide foils and ceramic substrates. We also give the correct treatment for trace thickness other than 35μ m. The temperature-current correlations follows closely a power

law $\Delta T = B_{LP} w^{-n} \left(\frac{35\mu}{th}\right) \cdot I^2$. The coefficients B_{LP} and *n* are derived for the calculated PCB models and the

correlations are plotted in usable diagrams.

Inhaltsverzeichnis

1.	Tempe	eratur und Leiterbahn	1
2.	Die D	esignrichtlinie IPC-2221	2
2	.1.	IPC-2221	2
2	.2.	Ursprung der IPC-2221	3
3.	Tempe	eratur und Strom	4
3	.1.	Joule'sche Heizleistung	4
3	.2.	Energiegleichgewicht	5
	3.2.1.	Der erste Hauptsatz	5
	3.2.2.	Energieabfuhr	5
3	.3.	Erste Simulationsversuche	6
	3.3.1.	Keine rückseitige Cu-Ebene	7
	3.3.2.	Mit rückseitiger Cu-Ebene	8
	3.3.3.	Innenliegende Leiterbahn	8
	3.3.4.	Vergleich mit IPC und DN	8
3	.4.	Neue Messungen im Rahmen der IPC-2152	9
3	.5.	Kritik an der IPC-2221	9
4.	Gerec	hnete Strombelastbarkeitsdiagramme 1	0
4	.1.	DN- und IPC-Situation	0
4	.2.	Strombelastbarkeit in anderen FR4 Leiterplattenaufbauten	1
4	.3.	Empirische Zusammenhänge der Parameter 1	12
	4.3.1.	Leiterbahnbreite 1	2
	4.3.2.	Leiterbahndicke1	3
	4.3.3.	Strombelastbarkeit in IPC Darstellung1	4
4	.4.	Polyimidfolie 1	8
4	.5.	Keramiksubstrat 1	9
5.	Nicht-	homogene Leiterbahnen 1	.9
5	.1.	Lokale Querschnittsverengung	9
5	.2.	Wärmeabfuhr durch Anschlusskabel	21
6.	Zusan	menfassung	21

1. Temperatur und Leiterbahn

Eine Leiterplatte (engl. printed circuit board, PCB) ist, vereinfacht gesagt, ein mit Hilfe von Kunstharz verpresstes Laminat aus kupferbeschichtetem Glasfasergewebe. Das Leiterbild auf den einzelnen Lagen wird dabei photochemisch durch Ätzung erzeugt. Die Temperaturbeständigkeit der Leiterplatte ist allerdings beschränkt. Beim Standardmaterial FR4 liegt die empfohlene Maximaltemperatur bei Dauerbelastung bei ca. 100 °C. Bei höheren Temperaturen kommt es zu chemischen Reaktionen, Delamination und Verbiegung und damit zu einem Verlust der elektrischen Funktionsfähigkeit. Eine Leiterbahn, durch die ein genügend hoher Strom fließt - was "genügend hoch ist", ist Gegenstand des Vortrags - heizt sich wie ein Tauchsieder auf und führt zu lokalen Zerstörungseffekten, die sich unter Umständen auf die gesamte Leiterplatte auswirken. Deshalb ist es wichtig den Zusammenhang zwischen Stromstärke und Temperatur zu kennen. Im deutschen nennt man das Strombelastbarkeit, im englischen *Current Carrying Capacity*. Wir beschreiben in diesem Vortrag, wie sich der Zusammenhang zwischen Temperatur und Stromstärke für verschiedene Leiterplattenaufbauten verhält.

2. Die Designrichtlinie IPC-2221

2.1. IPC-2221

Die Designrichtlinie IPC-2221 (=IPC-D-275=MIL-STD-275), und in ihrer deutschen Übersetzung FED 22-02, wird von Vielen als Grundlage für die Abschätzung der Leitertemperatur verwendet.



Abb. 2-1: IPC-2221 Nomogramm für "externe Leiter" (aus Brooks, 2001) mit Anwendungsbeispiel.

Die Benutzung geht folgendermaßen (gestrichelte Linien):

Schritt 1: Man bestimme den Leiterbahnquerschnitt F (in square mils=Quadrat-tausendstelInch) im unteren Hilfsdiagramm aus Leiterbahnbreite (in Inch) und der Leiterbahndicke (in oz)¹

Leiterbahndicke in oz	Leiterbahndicke in µm
0.5	17.5
1	35
2	70

Die Leiterbahnbreite b wird in Inches angegeben.

Leiterbahnbreite in Inches	Leiterbahnbreite in mm
0.1	0.25
1	2.54

Schritt 2: Man überträgt den Leiterquerschnitt in das obere Diagramm und liest das gewünschte Paar aus Stromstärke I und Temperaturerhöhung ΔT ab.

¹ Dickenangabe erfolgt über das Flächengewicht von Kupfer. 1 oz Kupfer, breitgedrückt auf 1 ft² ist 35 µm dick.

Brooks (1989) gibt eine Fitformel für die 1-oz Diagramme an

$$I = 0.065 \cdot \Delta T^{0.43} \cdot A^{0.68} \tag{2.1}$$

mit A hier in sq.mils, bzw.

$$\Delta T = 576 \cdot A^{-1.58} \cdot I^{2.33} \quad . \tag{2.2}$$

Außerdem diskutiert er Ergebnisse aus der Zeitschrift "Design News" (im folgenden DN) aus dem Jahr 1968 mit folgendem Ergebnis für 1 oz Leiterdicke

$$I = 0.04 \cdot \Delta T^{0.45} \cdot A^{0.69} \tag{2.3}$$

bzw.

$$\Delta T = 178 \cdot A^{-1.53} \cdot I^{2.22} \tag{2.4}$$

Die "Design News" I(ΔT) - Kurven sind also im Strom um den Faktor 0.065/0.04=1.63 gegenüber der IPC gestaucht, bzw. die $\Delta T/(I)$ -Kurven sind in ΔT um den Faktor 3.2 gestaucht.

Brook's etwas elaboriertere lineare Regression ergab (in seiner Notation) mit Leiterbreite W und -dicke Th

$$I = k_{DN} \cdot \Delta T^{0.46} \cdot W^{0.76} \cdot Th^{0.54}$$
(2.5)

Wir werden in Kap.4 wieder darauf zurückkommen.

Vielerorts hegen Praktiker Zweifel an der Gültigkeit des obigen Diagramms:

- in der Praxis können Leiterbahnen mit höheren Strömen belastet werden und
- die analogen Diagramme für "interne" Leiterbahnen sind in der Stromstärke um *exakt* den Faktor 2 reduziert.

Woher stammen eigentlich die Diagramme und was steckt wirklich dahinter?

2.2. Ursprung der IPC-2221

Brooks (2001) schreibt: "It is a result of the now recognized fact that the originals have been long lost and these copies have been recopied, rescanned, and redrawn countless times during the last 40+ years! It is remarkable (and a testimony to the care that has always been taken) that they are still as faithful to the originals as they are!"

Im Rahmen der Arbeiten für eine revidierte Designrichtlinie IPC-2152 ist es das Verdienst der IPC Task Group 1-10b um M. Jouppi (2002) die Quellen der IPC-2221 gefunden zu haben. Es waren dies Arbeiten für das National Bureau of Standards (NBS) aus dem Jahr 1956. Die Originalgraphiken (z.B. Abb. 2-2), die es für verschiedene Temperaturerhöhungen gibt, zeigen jeweils eine breite Streuung der Messwerte aufgrund der Tatsache, dass unterschiedliche Leiterplatten mit unterschiedlichem Lagenaufbau aus unterschiedlichem Material vermessen wurden.



Abb. 2-2: Reproduktion einer NBS Originalmessreihe für $\Delta T=20^{\circ}C$ (Jouppi, 2003).

Darin eingetragen, stellen sich die Brooks'schen Kurven Gl. (2.1) und (2.3) wie in Abb. 2-3 dar.



Abb. 2-3: Brooks'sche Fitkurven in den NBS Messungen. Durchgezogen: IPC-Fit, gestrichelt: DN-Fit.

Kann man der gemessenen Punktwolke trauen, kann man sie durch theoretische Berechnungen reproduzieren und daraus verallgemeinerte Erkenntnisse gewinnen?

3. Temperatur und Strom

3.1. Joule'sche Heizleistung

James Joule hat auf der Suche nach dem Wärmeäquivalent um 1841 experimentell den Zusammenhang zwischen der Heizleistung *P* [W] in einem Stromleiter und der Stromstärke *I* [A] (Gleichstrom)

$$P = R \cdot I^2$$
(3.1)
eiche Zeit, geht eine Formulierung für den elektrischen Widerstand

entdeckt. Auf Heinrich Lenz, etwa um die gleiche Zeit, geht eine Formulierung für den elektrischen Widerstand R [Ohm] eines Metalldrahts als Funktion seiner geometrischer Größen Länge L [m] und Querschnittsfläche A [mm²] und der Temperatur des Leiters T [°C] zurück

$$R = \frac{L}{A} \rho_{20} \left(1 + \alpha_{20} \cdot (T - 20^{\circ} \text{C}) \right).$$
(3.2)

 ρ_{20} [Ohm mm²/m] charakterisiert den spezifischen elektrischen Widerstand des Leitermaterials und α_{20} [1/K] einen Temperaturkoeffizient, jeweils hier bei 20°C. Die lineare Temperaturabhängigkeit ist natürlich nur eine lineare Approximation an den leicht gekrümmten Verlauf von $\rho(T)$ für Temperaturen unterhalb von ca. 1000 K.



Abb. 3-1: Temperaturabhängigkeit des spezifischen elektrischen Widerstands von reinem Kupfer (Dyos and Farrel, 1992). Bis zum Schmelzpunkt bei 1358 K ist die Abhängigkeit annähernd linear.

Für reines Kupfer und lineare Anpassung bei 20°C sind die Werte

$$\rho_{20}=0.0175 \text{ Ohm mm}^2/\text{m}$$
, $\alpha_{20}=0.00395 \text{ 1/K}$. (3.3)

Beispielsweise erhält man für den elektrischen Widerstand einer Leiterbahn mit Dicke $d=35 \,\mu\text{m}$, Breite $b=2 \,\text{mm}$ und Länge $L=10 \,\text{cm}$ ($A=d*b=0.07 \,\text{mm}^2$) $R=0.025 \,\text{Ohm}$. Den Widerstand R für eine andere Leiterlänge L erhält man aus Abb. 3-2 durch Multiplikation mit L [m] (Adam, 2002a).



Abb. 3-2: Elektrischer Gleichstromwiderstand einer Leiterbahn von 1 m Länge und 35 µm Dicke für verschiedene Leitertemperaturen und Leiterbahnbreiten nach Gl.(3.2).

3.2. Energiegleichgewicht

3.2.1. Der erste Hauptsatz

Die Beschreibung der Wärmeerzeugung nach Gln. (3.1) gilt für einen Tauchsieder (Joules Experimente) genauso wie für eine Leiterbahn auf einer Leiterplatte. Die Kenntnis der Heizung allein ist für eine Temperaturbestimmung nicht ausreichend. Der erste Hauptsatz der Thermodynamik lautet "Die Energie eines abgeschlossenen Systems ist konstant". In unserem Fall heißt das, dass die elektrische Leistung P [W] in thermische Formen der Energie umgewandelt werden muss, so dass im thermischen Gleichgewicht (d.h. im zeitlich eingeschwungenen Zustand) Netto Null herauskommt

Energiezufuhr - Energieabgabe = 0

Die Temperatur stellt sich als *Ergebnis* des Gleichgewichts von Heizleistung *P* und Kühlleistung K(T) ein P = K(T). (3.4)

Die elektrische Heizleistung ist also ein Energie(zu)fluß = Wärmemenge/Zeit [J/s = W] und ebenso ist die Kühlleistung ein Energiefluß.

3.2.2. Energieabfuhr

Drei Prozesse kühlen die Leiterbahn/Leiterplatte: Wärmeleitung, Konvektion und Strahlung. Der Wärmefluss P, der in der Leiterbahn entsteht, wird über Wärmeleitung in das Leiterplattenmaterial transportiert und dort mehr oder weniger stark geometrisch gespreizt. Der "Temperaturfleck" gibt einen Teil des Wärmeflusses an die Luft ab (Konvektion) und einen Teil über Wärmestrahlung (Infrarotphotonen) an die Umgebung²



Abb. 3-3: Leiterbahn und Leiterplatte im Querschnitt mit den 3 Wärmetransportmechanismen

 $^{^{2}}$ *Q* ist der Formelbuchstabe für die Wärmemenge [J] und der Punkt darüber das Symbol für die zeitliche Änderung [J/s], sprich den Wärmefluß.

Wenn der Wärmestrom gut abfliest, ergibt sich bei gleicher Verlustleistung eine niedrige Temperatur *T*, wenn er schlecht abfliest, eine höhere Temperatur. Die vereinfachten formelmäßigen Zusammenhänge sind folgende (*A* in m², *T* in [K]) (T_U = Umgebungstemperatur):

Wärmeleitung	Fouriersches Gesetz	$\dot{Q}_{Ltg} = \lambda \cdot \frac{T_2 - T_1}{d} \cdot A$	λ Wärmeleitfähigkeit des Festkörpers, <i>d</i> Schichtdicke, <i>A</i> Kontaktfläche
Konvektion	Newtonsches Gesetz	$\dot{Q}_{konv} = \alpha(T) \cdot A \cdot (T_{Platte} - T_U)$	α Wärmeübergangskoeffizient, A LP-Fläche
Wärmestrahlung	Stefan-Boltzmann- Gesetz	$\dot{Q}_{rad} = \varepsilon \cdot \sigma \cdot A \cdot (T_{Platte}^4 - T_U^4)$	ε Emissionskoeffizient (IR), A LP- Fläche, σ =5.6 10 ⁻⁸ W/m ² K ⁴ , T hier unbedingt in [K]

Typische Zahlenwerte in den obigen Gleichungen sind:

• Wärmeleitfähigkeit (Stoffeigenschaft)

Stoff	$\lambda [W/(m^*K)]$
Reinkupfer	390
Reinaluminium	240
Reinsilizium @ 100 °C	117
Rein-FR4	0.3
FR4 realistisch	0.5
Luft (ruhend)	0.026

• Wärmeübergangszahl (keine Stoffkonstante !!)³

Strömungstyp	$\alpha [W/m^{2*}K]$
Freie Konvektion	$\alpha \approx 57 \text{ W/(m^2 K)}$
(Auftriebsströmung)	
Erzwungene Konvektion	$\alpha \approx 10 \dots 50 \text{ W/(m^2 K)}$
(Lüfterströmung)	je nach Luftgeschwindigkeit

• Infrarot-Emissionskoeffizient (Oberflächeneigenschaft)

Oberfläche	ε[-] 3
Aluminium (Metalle) poliert	0.03
Aluminium oxidiert	0.2 0.3
Lacke (alle Farben), Kunststoffoberflächen	0.8 0.9
Keramik	0.5

Eine quantitative Auswertung für ein Beispiel wird weiter unten gegeben: für die dort beschriebene Situation verliert die Leiterplatte ca. 1/3 der Verlustleistung über Konvektion und ca. 2/3 über Infrarotstrahlung. Die Berechnung des Energiegleichgewichts ist wg. der nicht-linearen Zusammenhänge in K(T) zwischen Temperatur und Wärmefluss (Stichwort Nusselt-Korrelationen), und der unbekannten Größe des Temperaturflecks mit analytischen Methoden unseres Wissens nicht allgemein möglich. Deshalb werden wir in Abschnitt 3.5 und Kap. 4 numerische Verfahren mit kommerziell erhältlicher Software verwenden.

3.3. Erste Simulationsversuche

Wir verlassen jetzt die eingetretenen Pfade und gehen die Sache mit numerischen Methoden an. Darunter verstehen wir Computersimulation der Thermodynamik *und* der Strömungsmechanik in und um das System Leiterbahn

³ Die Bestimmung von α ist ein weites Feld. α hängt nicht nur von der Luftgeschwindigkeit ab, sondern auch von der Geometrie und Größe des umströmten Körpers.

 \rightarrow Leiterplatte \rightarrow Umgebung in 3 Dimensionen. Wir behandeln hier nur den thermischen Beharrungszustand. Die partiellen Differentialgleichungen, die dabei in diskretisierter Form numerisch gelöst werden, sind die Fouriergleichung (Wärmeleitung), die Navier-Stokes-Gleichung (Impulserhaltung der Strömungsmechanik) und die Kontinuitätsgleichung (Massenerhaltung). Dazu kommen noch universelle, dimensionslose Wärmeübergangsgesetze (Wandfunktionen). Wir benutzen das Programm FLOTHERM[®] von Flomerics. Die Genauigkeit der Ergebnisse liegt in der Größenordnung von +- 5% bzgl. Umgebungstemperatur.

Wir verfolgen 2 Ziele:

- 1) zu verstehen, was der Hintergrund der Unterschiede der IPC und der DN. Kann man auf rechnerischem Wege die Kurven *reproduzieren*?
- 2) Sollten die IPC Kurven berechenbar sein, dann werden wir die Methode auf *neue Szenarien* anwenden, für die die IPC Kurven nicht gemacht sind.

Die geometrischen Größen sind wie in Abb. 3-4 definiert.



Abb. 3-4: Definition der Breite und Dicke der Leiterbahn auf der Leiterplatte

Da wir die genauen Daten des Original NBS Setups nicht kennen, machen wir uns ein Modell aus

- einer Euro-LP (100 mm x 160 mm x 1.6 mm) aus "*reinem" FR4* (λ=0.3 W/m K, ε=0.9),
- darauf *einer* Leiterbahn aus Kupfer von Länge L=100 mm, Dicke $d=35 \mu m$ (=1 oz),
- optional einer Cu-Ebene auf der Rückseite der Leiterplatte,
- einem Luftvolumen, das etwas größer ist als die Leiterplatte in der die Luft in freier Konvektion strömt und
- stellen die Leiterplatte senkrecht (das ist nicht wesentlich).
- In das Leiterbahnvolumen legen wir eine feste Leiterbahntemperatur T_{LB} (bzw. Übertemperatur ΔT).
- FLOTHERM berechnet das Energiegleichgewicht aus Wärmeleitung, Konvektion und Strahlung⁴ für freie Konvektion mit strömungsmechanischen Methoden (ohne Vorgabe des Wärmeübergangs)
- Wir lassen uns aus dem Endergebnis den gesamten abgegebenen Wärmestrom (Leistung) *P*, der die Leiterplatte und Leiterbahn verlässt, ausdrucken.
- Aus dem Wärmestrom *P* folgt nach Gl. (3-1) und (3-2) die Stromstärke *I*.

3.3.1. Keine rückseitige Cu-Ebene

Das Ergebnis für *T*_U=20 °C, *T*_{LB}=40 °C (Δ*T*=20 °C), *b*=5 mm (=197 mils), *d*=35 μm (*A*=0.175 mm²) ist

$$\dot{Q}_{rad} = 0.34 \,\mathrm{W}, \dot{Q}_{konv} = 0.20 \,\mathrm{W} \Longrightarrow P = 0.54 \,\mathrm{W}$$

Die dazugehörende Stromstärke folgt aus

$$I = (P/R)^{1/2} = (P \cdot \frac{b \cdot d}{L \cdot \rho_{20} (1 + \alpha_{20} (T_{LB} - 20))})^{1/2}$$
(3.5)

und ergibt I=7.1 A.

Das berechnete Temperaturbild auf der LP ist in Fig. 3-5 dargestellt. Wegen der geringen Leitfähigkeit des FR4 ist die Wärmespreizung auf/in der Leiterplatte klein. Man sieht anhand dieser Abbildung, dass je länger die Leiterbahn ist, auch die Kühlfläche in gleichem Maße zunimmt. Deshalb ist die Länge kein Input Parameter für die IPC-2221.

⁴ Dauert weniger als 1 Minute auf dem PC.



Abb. 3-5: Perspektivische Darstellung des Simulationsergebnis für eine 100 mm langen Leiterbahn (b=5 mm, $d=35 \mu$ m) mit 20°C Übertemperatur auf einer Euro-LP aus reinem FR4. Links: Oberflächentemperaturen sind als Farben dargestellt, rechts: berechnete Luftströmung (v_{max} ca. 0.3 m/s).

3.3.2. Mit rückseitiger Cu-Ebene

- Wie in vorhergehender Rechnung: 1 belastete Leiterbahn: $d=35 \mu m$, b=5 mm, L=0.1 m, $\Delta T=20 °C$
- auf der Rückseite eine *vollgeflutete* Cu-Ebene: Dicke=35 µm, 100 x 160 mm

Ergebnis für Leiterbahnbreite b=5 mm: P=1.30 W entspricht I=11.0 A.

Die Stromstärke ist höher, weil die Wärme durch die Kupferfläche besser verteilt wird und dadurch eine effektiv größere Fläche zur Wärmeübertragung an die Umgebung hat.



Abb. 3-6: Euro-LP mit einer belasteten Leiterbahn (b=5mm, $\Delta T=20$ °C) und eine kompletten Cu-Ebene auf der Rückseite (d=35 µm). Die Wärmespreizung ist wesentlich deutlicher als in Fig. 3-5.

3.3.3. Innenliegende Leiterbahn

Das gleiche Beispiel für die Leiterbahn mittig in der Innenlage (ohne Kupferrückseite) gerechnet ergibt: P=0.57 W, I=7.3 A. Es gibt also kaum einen Unterschied zu 0.54 W.

Wir sehen, dass bei innenliegenden Leiterbahnen genau die Hälfte von 7 A herauskommen soll, ist physikalisch durch nichts motiviert. Brooks (1998) schreibt süffisant: "*I have heard rumors (which I have not confirmed) that the IPC internal charts were simply derated 50% from the external ones.*" Jouppi (2002) bestätigt ebenfalls, dass es keinen experimentellen Hinweis darauf gibt, dass sich innenliegende Leiterbahnen wesentlich anders verhalten sollten als aussenliegende.

3.3.4. Vergleich mit IPC und DN

Wir vergleichen in Abb.3-7 unsere numerischen Rechnungen mit Gln. (2-1) und (2-3). Die Übereinstimmung ist sehr gut.



Abb. 3-7: Strombelastbarkeit zu *d*=35 µm und ∆T=20 °C aus Simulationsergebnissen ("FT") und Brook's Fitkurven zur IPC-2221 und zu "Design News".

Man kann also zusammenfassen, dass

• *die IPC-Kurven nur für eine 2-seitig kupferkaschierte Leiterplatte mit ungeätzter Rückseite* und

• *die DN Kurven nur für eine 1-lagige Leiterplatte* gelten.

3.4. Neue Messungen im Rahmen der IPC-2152

Jouppi (2002) präsentiert für die Neuauflage der IPC-Designrichtlinie, genannt IPC-2152⁵, einen neuen experimentellen Aufbau und einen Teil der daraus abgeleiteten Strom-Temperatur-Zusammenhänge. Neu gegenüber der IPC-2221 sind Messungen unter Vakuumbedingungen. Die Ergebnisse der entsprechenden Modelle sind in Abb. 3-8 mit seinen Messungen verglichen. Die neuen Messungen zur IPC-2152 können durch unsere numerischen Rechnungen ebenfalls bestens reproduziert werden.



Abb. 3-8: Temperaturanstieg in der Leiterbahn als Funktion der Stromstärke für 3 Szenarien aus der neuen IPC-2152. Symbole: Messungen (Jouppi, 2002), Kurven: Simulationen. (Adam, 2002b).

3.5. Kritik an der IPC-2221

Aus der Analyse dieser und anderer Berechnungsergebnisse kann man folgende Kritikpunkte an der IPC-2221 zusammenfassen

• Die Diagramme (Abb. 2-1) gelten nur für einen Typ von Leiterplattenaufbau.

⁵ Die Arbeiten an dieser Richtlinie scheinen eingeschlafen zu sein.

- Es gibt kaum Unterschiede zwischen der Temperaturerhöhung einer außenliegenden und innenliegenden Leiterbahn. Die Unterscheidung ist Hysterie.
- Die reine Abhängigkeit der Strombelastbarkeit von A in Abb. 2-1 kann nicht richtig sein. Beispielsweise hat die Leiterbahn in Abb. 3-9 den gleichen Querschnitt, aber es ist die Grundfläche auf der Leiterplatte, die den Wärmeeintrag in die LP und dadurch die Kühlung mitbestimmt. Die linke Konfiguration kann bei gleicher Temperatur mit einem höheren Strom belastet werden.



Abb. 3-9: Fehler in der IPC-2221. Die Leiterbahnen links und rechts haben den gleichen Querschnitt, können aber bei gleichem Strom nicht die gleiche Temperatur haben.

4. Gerechnete Strombelastbarkeitsdiagramme

4.1. DN- und IPC-Situation

Mit dem oben diskutierten Berechnungsmodell und -verfahren berechnen wir Leitertemperaturen für ein erweitertes Feld von Parametern.



Abb. 4-1: Temperatur-Strom-Diagramme für eine 35μ m dicke Leiterbahn bei Umgebungstemperatur 20°C. 1: auf einer reinen FR4 Leiterplatte (DN-Situation), 2: auf einer LP mit 35 μ Cu-Rückseite (IPC-Situation). Scharparameter ist die Leiterbahnbreite *b* (in mm) zwischen 0.2 und 10 mm.

4.2. Strombelastbarkeit in anderen FR4 Leiterplattenaufbauten

Die erfolgreiche Reproduktion der IPC-2221 Kurven ermutigt zur Anwendung auf andere Leiterplattenszenarien. Die berechneten Leiterplattenaufbauten⁶ (Adam, 2003, 2004a,b,c) sind in Abb. 4-2 zusammengefasst. Das Basismaterial ist FR4, Leiterplattendicke ist immer 1.6 mm.



⁶ Die Leiterplattenaufbauten wurden vorgeschlagen von Dr. Ch. Lehnberger, Andus GmbH, Berlin

Haus der Technik, Tagung Elektronikkühlung, Essen 27.2.-28.2.2007 J. Adam, Strombelastbarkeit von Leiterbahnen



Abb. 4-2: Temperatur-Strom-Diagramme von Leiterplatten mit unterschiedlichem Lagenaufbau und einer 35 µm dicken Leiterbahn unterschiedlicher Breite (aus Adam, 2003).

4.3. Empirische Zusammenhänge der Parameter

4.3.1. Leiterbahnbreite

Da sich die Diagramme ähnlich sehen, versuchen wir einen "universellen' Zusammenhang zu entwickeln. Die Ergebnisse von Abb. 4-1(2), d.h. die IPC Situation, dekadisch doppelt-logarithmisch aufgetragen, zeigen Geraden der Steigung 2, d.h. einen $\Delta T=B*P$ -Zusammenhang (Abb.4-3 links). Jede Gerade gehört zu einer bestimmten Leiterbreite *b*, wobei die unteren zu den großen Leiterbreiten gehören. Nun experimentieren wir mit einer modifizierten y-Achse, um die verschiedenen Leiterbreiten zu vereinheitlichen. Zwischen $y' = \Delta T / b [\text{mm}]^{-1.4}$ und $y' = \Delta T / b [\text{mm}]^{-1.5}$ ordnen sich die berechneten Werte bei nicht all zu kleinen Stromstärken fast alle auf einer log y'-log *I*-Geraden der Steigung 2. Also ist y'=cP. Wir entscheiden uns für den Exponenten -1.45 (Abb. 4-3 rechts)

$$\Delta T = B_{LP} b^{-1.45} I^2 \qquad . \tag{4.1}$$



Abb. 4-3: Entwicklung eines empirischen Zusammenhangs zwischen Temperaturerhöhung, Stromstärke und Leiterbahnbreite. Links: Rohversion für die IPC Leiterplatte ergibt im doppeltlogarithmischen Diagramm eine Gerade mit Steigung 2. Rechts: mit Einbeziehung der Leiterbreite in y'.

Die Proportionalitätskonstante B_{LP} hängt vom Leiterplattenaufbau (Kupfergehalt und Abstand der Leiterbahn von der ersten Cu-Lage) ab und ist für die IPC-Werte (Abb. 4-3) $B_{LP} = 10^{0.24} = 1.7$. Die Hilfsdiagramme der anderen Leiterplatten sehen sehr ähnlich aus und in log y' nur nach oben oder unten parallel verschoben. In Tab. 4-1 fassen wir die Koeffizienten B_{LP} zusammen. Je besser die effektive thermische Leitfähigkeit der Leiterplatte ist, desto kleiner ist B_{LP}.

Tab. 4-1: Werte des Koeffizienten B_{LP} für Gl. (4.1)

Leiterplattenaufbau	$log B_{LP}$	B_{LP}
1 (DN)	0.56	3.6
2 (IPC)	0.24	1.7
3	0.30	2.0
4	0.10	1.2
5	-0.02	0.95
6	0.13	1.3
7	0.03	1.1

Es ist näherungsweise möglich auch den Koeffizienten *B* durch geometrische und thermische Eigenschaften der Leiterplatte zu parametrisieren. Eingangsgrößen sind der thermische Widerstand zwischen Oberfläche und erster Kupferlage und die horizontale Leitfähigkeit (quasi Kupfergehalt) der Leiterplatte. Wegen der Komplexität verzichten wir hier jedoch auf eine Darstellung.

4.3.2. Leiterbahndicke

Die berechneten obigen Diagramme (wie die der IPC-2221 auch) gelten nur für die Leiterbahndicke $d=35 \mu m$. Wie sind die Verhältnisse bei anderer Dicke d? Entscheidend für die Temperatur ist der Wärmeeintrag durch die Verlustleistung P über den Footprint der Leiterbahn. Angenommen, wir wollen die obigen ΔT -I-Diagrammen für eine Leiterbahn der doppelten Dicke, also $d=70 \mu m$ verwenden, dann müssen wir **die Kurve für dieselbe Leiterbahnbreite** b benutzten. Allerdings ist der Widerstand der Leiterbahn bei $d=70 \mu m$ nur halb so groß. Wegen $P=R*I^2$ würde aber ein $\sqrt{2}$ -mal stärkerer Strom wieder die gleiche Verlustleistung und damit die gleiche Temperaturerhöhung bringen. Die Temperatur ist gleich, wenn die Leistung $R*I^2$ und die Leiterbreite gleich sind. Diese Skalierungsregel für andere Leiterbahndicken d kann man demnach schreiben als

$$\frac{1}{35\mu \cdot b} \cdot I_{35\mu}^2 = \frac{1}{d \cdot b} I^2 .$$
(4.2)

 $I_{35\mu}$ wird in G.l. (4.1) benutzt bzw. definiert

$$\Delta T = B_{LP} \, b^{-1.45} I_{35\mu}^2$$

 $I_{35\mu}$ aus Gl. (4.2) darin eingesetzt ergibt als allgemeinen Zusammenhang (*d* ist natürlich in μ m zu messen, *b* in mm):

$$\Delta T = B_{LP} \left(\frac{b}{\mathrm{mm}}\right)^{-1.45} \left(\frac{d}{35\,\mu\mathrm{m}}\right)^{-1} \cdot I^{2} \qquad (4.3)$$

Erinnern wir uns an Brook's Gl. (2.5) $T = k_{DN} \cdot \Delta T^{0.46} \cdot W^{0.76} \cdot Th^{0.54}$! Wenn wir Gl. (4.3) nach *I* auflösen, ergibt sich

$$I = B_{LP}^{-0.5} \cdot \Delta T^{0.5} \cdot \left(\frac{b}{\mathrm{mm}}\right)^{0.72} \cdot \left(\frac{d}{\mu \mathrm{m}}\right)^{0.5},$$

also so gut wie das identische Ergebnis, nur dass ihm die entsprechende Empirie für die IPC nicht zur Verfügung stand.

Ein kleines Anwendungsbeispiel: Eine Leiterbahn mit Breite b=5 mm aus Dickschichtkupfer $d=100 \ \mu m$ auf einer einlagigen Leiterplatte (DN-Typ) darf sich um 40 °C gegen Umgebung erhitzen. Die maximale Stromstärke ist dann ca. 18 A

4.3.3. Strombelastbarkeit in IPC Darstellung

In den folgenden Diagrammen ist nach Gl. (4.4) mit den Koeffizienten aus Tab. 4-1 die Standard IPC Darstellung I(Δ T) für d=35 µ aufgetragen

$$I = \sqrt{\frac{\Delta T}{B_{LP}} \left(\frac{b}{\text{mm}}\right)^{1.45}} \qquad (4..4)$$

Für eine andere Leiterdicke d (in µm) ist der abgelesene Wert von I mit $\sqrt{d/35\mu m}$ zu multiplizieren. Die Nummerierung entspricht Tabelle 4-1.









Abb. 4-4: Strombelastbarkeit in einer IPC-ähnlichen Darstellung für die FR4-Leiterplattenaufbauten aus Tab. 4-1. Die Leiterbahndicke ist 35 µm (1 oz). Für eine andere Leiterbahndicke d (in µm) ist der abgelesene Wert von I mit $\sqrt{d/35\mu m}$ zu multiplizieren. Scharparameter ist die Temperaturerhöhung in °C.

Leiterbahnbreite [mm]

© Flomerics 2006

4.4. Polyimidfolie

In flexiblen Leiterplatten(teilen) werden dünne Polyimidfolien benutzt. Wir berechnen T(I) Diagramme wie in Kap. 3.3 für eine dünne Polyimidfolie der Dicke 0.3 mm mit Wärmeleitfähigkeit λ =0.3 W/m-K.



Abb. 4-5: Temperatur-Strom-Diagramm für eine $35\mu m$ dicke Leiterbahn auf einer Polyimidfolie der Dicke 0.3 mm.

Die gleiche Analysetechnik wie in Kap. 4.3.1. ergibt

$$\Delta T = 4.9 \left(\frac{b}{\mathrm{mm}}\right)^{-1.45} \left(\frac{35\mu}{d}\right) I^2 \tag{4.5}$$



Abb. 4-6: Strombelastbarkeit in einer IPC-ähnlichen Darstellung für eine dünne Polyimidfolie. Die Leiterbahndicke ist 35 μ m (1 oz). Für eine andere Leiterbahndicke d (in μ m) ist der abgelesene Wert von I mit $\sqrt{d/35\mu}$ m zu multiplizieren. Scharparameter ist die Temperaturerhöhung.

4.5. Keramiksubstrat

Das kunststoffbasierte Trägermaterial ersetzen wir nun durch eine 1 mm dicke Keramikplatte mit Wärmeleitfähigkeit λ =16 W/m K. Er gibt sich (Adam, 2004c)

$$\Delta T = 0.45 \left(\frac{b}{\mathrm{mm}}\right)^{-1.1} \left(\frac{35\mu}{d}\right) I^2.$$
(4.6)

Man beachte, dass der Exponent für b sich signifikant geändert hat.





5. Nicht-homogene Leiterbahnen

5.1. Lokale Querschnittsverengung

Sollte eine Leiterbahn ihren Querschnitt ändern, dann sind die IPC Diagramme nicht mehr zu gebrauchen. Wir zeigen dies an einem einfachen gerechneten Beispiel. In Kürze die Parameter:

- 2 Zuleitungen: 50 mm Leiterbahnlänge, 2 mm Leiterbreite
- Engstelle: 3 mm Länge, 0.7 mm Breite
- Leiterdicke 35 µm Cu

Wir wählen die Stromstärke so, dass ohne Engstelle gemäß Strombelastbarkeitsdiagramm No.1 eine Temperaturerhöhung ΔT =60 °C, d.h. eine Leitertemperatur von 80°C, herauskommt (Abb. 5-1).



Abb. 5-1: Basismodell ohne Engstelle: nur Zu- und Ableitung mit 6.7 A belastet. Die Temperatur der Leiter ist erwartungsgemäß 78°C bis 80 °C.

Mit einer Engstelle ist die IPC leider nicht zu gebrauchen. Die ergäbe nämlich Temperaturen über 200 °C, wenn man in Gl. (4.3) die geometrischen Daten nur für die Engstelle einsetzt. In Wirklichkeit wirken die Zu- und Ableitungen als Kühlkörper, so dass die Engstellentemperatur auf 111°C einstellt (Abb. 5-2 und 5-3).



Abb. 5-2: Modell mit Engstelle. Die Temperatur steigt dort (nur) auf 111 °C.



Abb. 5-3: Zoom um die Engstelle.

5.2. Wärmeabfuhr durch Anschlusskabel

Wie immer in der Elektronikkühlung ist es gefährlich nur Teile des wärmetransportierenden Netzwerks zu betrachten. Oft stimmen Berechnung und Messung nicht überein, weil die Wärmeableitung über die Anschlusskabel nicht berücksichtigt wird. Die Kabel sind in der Thermographie nicht warm, weil sie durch Joulesche Heizung erwärmt werden, sondern weil sie Wärme von der Wärmequelle zum Netzteil transportieren. Das Beispiel in Abb. 5-4 links zeigt eine 4-lagige Testleiterplatte mit 4 Leiterzügen. Die Anschlusskabel sind mit einem MKDSP25 Steckverbinder von Phoenix Contact angeschlossenen. Über jedes Kabel fließen 100 A und heizen die Oberfläche auf ca. 60°C-65 °C auf. Bei genauer Betrachtung der Thermographieaufnahme (rechts) sieht man dass die Anschlusskabel warm sind.



Abb. 5-4: 4-lagiges Testboard mit 4x100 A Belastung. Die Infrarotaufnahme zeigt warme Kabel (Quelle: Phoenix Contact GmbH, Blomberg).

Die numerische 3D-Simulation der Leiterplatte mit ihren Leiterbahnen und dem Steckverbinder ergibt demnach eine mit 106 °C (Abb. 5-5 links) zu hohe Temperaturen (Adam, 2005). Erst durch Hinzunahme der Kabel, obwohl sie ebenfalls mit 100 A geheizt werden, stimmen Messung und Rechnung überein. Die Wärme fließt von den Leiterbahnen über den Steckverbinder in die Kabel. Die Kabel werden durch die Wärmabgabe an die Umgebung und an das Netzteil als Wärmesenke gekühlt.



Abb. 5-5: Vergleich der Berechnungsergebnisse mit und ohne Kabel. Mit Kabel stimmen sie mit der Messung überein.

6. Zusammenfassung

In diesem Beitrag haben wir 4 Ziele erreicht:

- 1. Aufklärung über die Herkunft und Beschränkungen der Designregel IPC-2221 (=IPC-D-275).
- 2. Beweis der Reproduzierbarkeit durch numerische Simulation.
- 3. Extrapolation auf andere Leiterplattenszenarien durch numerische Simulation.
- 4. Fassen der berechneten Ergebnisse in formelmäßige Zusammenhänge (Korrelationen).

Die Diagramme können für eine erste Abschätzung der Strombelastbarkeit einer Leiterbahn verwendet werden. Aussagen für eine detailliertere Leiterform (Verengungen, Verzweigungen) können damit nicht gemacht werden. Dazu sind nur numerische Modelle in der Lage.

Danksagung

Dr. D. Niemeier, Fa. Flomerics, sei für sorgfältiges Korrekturlesen gedankt.

Literaturverzeichnis

Adam, J.: "Strombelastbarkeit von Leiterbahnen. Teil I Grundlagen". PLUS 4(2002a) Heft 10, S. 1669-1673

- Adam, J.: "Strombelastbarkeit von Leiterbahnen. Teil II IPC-Richtlinie IPC-D-275: Mythos und Wirklichkeit". PLUS 4(2002b) Heft 11, S. 1817-1823
- Adam, J.: *IPC-2152: Neue Richtwerte für die Strombelastbarkeit von Leiterzügen in Leiterplatten.* Konferenzband 11. FED-Konferenz (2003), S. 11-33
- Adam, J.: "New Correlations Between Electrical Current and Temperature Rise in PCB Traces". Proc. 20th IEEE SEMI-THERM Symposium, 292-299 (2004a)
- Adam, J.: "Strombelastbarkeit von Leiterbahnen III. Weitere Diagramme für Multilayer und Umrechnungsregeln", PLUS 6 Heft 4, 513-518 (2004b)
- Adam, J.: "*Neues von der Strombelastbarkeit von Leiterbahnen*", DVS/GMM-Fachtagung "Elektronische Baugruppen - Aufbau- und Fertigungstechnik. GMM-Fachbericht **44**, 117-123 (2004c)
- Adam, J.: Hochstromplatinen: Alleine und im Team. Phoenix Contact Technologietag (2005)
- Brooks, D.: *"Temperature Rise in PCB Traces"*, pdf-file <u>http://www.ultracad.com/articles/pcbtemp.pdf</u> Reprinted from the Proceedings of the PCB Design Conference, West, March 23-27 (1998)

Brooks, D.: "Using the IPC temperature charts" http://www.ultracad.com/using_ipc_temp_charts.pdf (2001).

Dyos, G.T., Farrel, T. (Eds.) 1992: Electrical Resistivity Handbook. Peter Peregrini Ltd. Stevenage.

Flomerics Ltd.: www.flotherm.com

Jouppi, M.R.: *Thermal Characterization of PCB Conductors*, paper IPC 39. Electronics Circuits World Convention 9 Köln, October 7-9 (2002)

Jouppi, M.R.: <u>http://www.thermalman.com</u> (2003). Existiert nicht mehr.